

测厚仪 江苏一六仪器 光谱分析仪

产品名称	测厚仪 江苏一六仪器 光谱分析仪
公司名称	江苏一六仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇成功路168号
联系电话	18915487005

产品详情

一六仪器 专业测厚仪 多道脉冲分析采集，先进EFP算法 X射线荧光镀层测厚仪

应用于电子元器件，LED和照明，电镀膜厚仪，家用电器，通讯，汽车电子领域.EFP算法结合精准定位解决了各种大小异形多层多元素的涂镀层厚度和成分分析的业界难题

这些方法中前五种是有损检测，测量手段繁琐，速度慢，多适用于抽样检验。X射线和 射线法是无接触无损测量，但装置复杂昂贵，测量范围较小。因有源，使用者必须遵守射线防护规范。X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。 射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。

随着技术的日益进步，特别是近年来引入微机技术后，采用磁性法和涡流法的测厚仪向微型、智能、多功能、实用化的方向进了一步。测量的分辨率已达0.1微米，精度可达到1%，测厚仪厂家，有了大幅度的提高。它适用范围广，量程宽、操作简便且价廉，是工业和科研使用广泛的测厚仪器。采用无损方法既不破坏覆层也不破坏基材，检测速度快，能使大量的检测工作经济地进行。

一六仪器 专业测厚仪 多道脉冲分析采集，先进EFP算法 X射线荧光镀层测厚仪

应用于电子元器件，LED和照明，家用电器，通讯，汽车电子领域.EFP算法结合精准定位解决了各种大小异形多层多元素的涂镀层厚度和成分分析的业界难题

镀层厚度分析仪的测量方法主要有：楔切法，光截法，光谱分析仪，电解法，厚度差测量法，称重法，X射线荧光法， 射线反向散射法，电容法、磁性测量法及涡流测量法等等。这些方法中前五种是有损检测，测量手段繁琐，速度慢，多适用于抽样检验。

X射线和 射线法是无接触无损测量，测量范围较小，X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。 射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆

层测厚时采用。

一六 荧光测厚仪 十年以上研发团队 集研发生产销售一体

元素分析范围:氯(Cl)- 铀(U) 厚度分析范围:各种元素及有机物

一次可同时分析:23层镀层，24种元素 厚度检出限:0.005um

(一)、内部结构

X荧光光谱测厚仪机型很多，但是其内部结构如果先天不足，后期的外部结构无论自动化多高，也无法完全满足客户需求。内部结构重要的3点：

- 1、X荧光发射和CCD观测是否同步和垂直？
- 2、测试样品是否可以变化测头到样品的距离？
- 3、X光照射面积从出口到样品的扩散情况。

(二)、各种内部结构的优缺点

1、X荧光发射和CCD观测样品只有同步且垂直才不会因为样品的高低深浅变化而改变测试到样品的位置，才能保证定位精准，测厚仪，同时减少与探测器或计数器的夹角，夹角小测试时

受样品曲面或者倾斜影响小。

2、测试样品距离可变化才能测试高低不平带凹槽的样品工件，同时也兼顾好平面样品的测试。但是它需要配备变焦镜头和变焦

补偿射线的算法。

3、X光照射面积从出口到样品的扩散过于严重会导致无法测试样品工件上较小的平面位置，如果减小出口（准直器直径），又会严重耗损X光的强度。

因此一台此类仪器的小准直器不是关键，但是测试面积却是个重要的指标。

测厚仪-江苏一六仪器-光谱分析仪由江苏一六仪器有限公司提供。测厚仪-江苏一六仪器-光谱分析仪是江苏一六仪器有限公司（www.16elite.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：邓女士。